**Сивченко Александр Сергеевич. Определение надёжности суб-100-нм КМОП ИС методом ускоренных испытаний тестовых структур, размещенных на полупроводниковой пластине;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»], 2021**